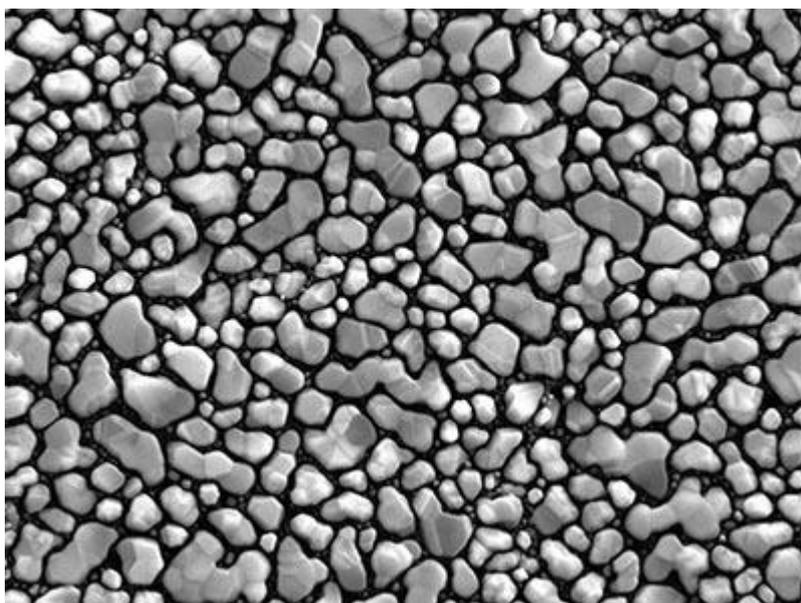


EM-Tec Au on C または Ni on C 解像度標準

カーボン基板上の Au または Ni 粒子解像度標準



EM-Tec Au on C Au 粒子解像度標準 1、5-200nm

イントロダクション

この Au または Sn 粒子解像度標準は、SEM、CD-SEM、FESEM、FIB、マイクロプローブ、オージェ、および SIMS システムで最適な解像度、設定、ビーム サイズ、および非点収差補正を得るために不可欠なツールです。

一般的に使用されている標準は次のとおりです。

- カーボン基板上の Au 粒子
- カーボン基板上の Sn 粒子。

カーボン基板上の Au 粒子は豊富な機能を備えており、二次電子 (SE) イメージングに優れた信号強度を提供します。低電圧後方散乱電子 (BSE) イメージングにも適しています。ほぼ完璧な円形の Sn 粒子は形状が分かりやすく、Au が使用できない用途にも使用できます。様々なイメージング用途に対応するため、複数の粒子サイズをご用意しています。カーボン基板はすべて直径 6mm、高さ 2mm です。

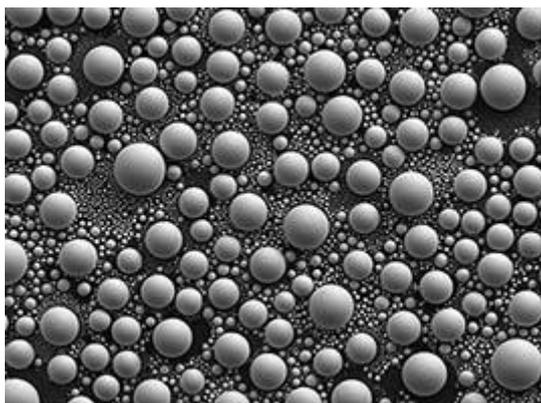
EM-Tec Au on C Au 粒子解像度標準

EM-Tec Au on C Au 粒子解像度標準は、比較的鮮明な形状、分散した個々の粒子、および炭素基板に対する優れたコントラストを提供します。

EM-Tec Au on C 分解能試験サンプルには 次の 4 つのサイズがあります。

- EM-Tec 1 は、5~200nm の Au 粒子を含有しています。
標準 SEM における解像度試験に最適です。15,000 倍以上の倍率でご使用ください。
- EM-Tec 2 に 30~300nm の Au 粒子を含有しています。この校正用試料は、低 kV および中倍率分解能の試験用に開発されました。Au 粒子の美しい双晶構造が特徴です。10,000 倍以上の倍率でご使用ください。
- EM-Tec 3 は、3~50nm の Au 粒子を充填し、SEM および FESEM の高解像度検査に使用できます。50,000 倍以上の倍率でご使用ください。
- EM-Tec 4 は、2~30nm の Au 粒子を充填し、FESEM の超高解像度検査に使用します。100,000 倍以上の倍率でご使用ください。

EM-Tec の解像度標準試料は、マウントされていない状態、または一般的な SEM スタブにマウントされた状態で提供されます。下の校正標準試料および試験試料用の試料マウントのリストをご覧ください。



31-022100 EM-Tec Sn on C 解像度標準 6、5nm-30um

EM-Tec Sn on C 解像度標準

炭素上のスズ球は、SEM、FESEM、FIB、CD-SEM、マイクロプローブ、オージェ、および SIMS システムの解像度を評価するための優れた試験標本です。さまざまなサイズのほぼ完璧な円形の球体は、画像品質、明るさとコントラスト（グレー レベル）、最適なプローブ サイズ、非点収差の補正を決定するのに特に適しています。SEM で金担持カーボンが使用できない場所では、Sn on C が使用されます。丸い球体の形状は認識しやすく、Au on C よりも使いやすいです。ただし、全体的な信号レベルは Au on C の信号レベルよりも低くなります。

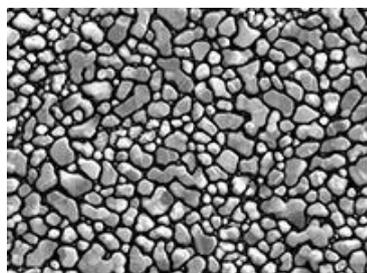
錫球の分解能校正標準には次の2つのサイズがあります。

- EM-Tec 6 は、5nm～30 μ m の Sn 球を含有しています。この解像度標準は広い倍率範囲をカバーし、100 倍程度から始まる中倍率および低倍率範囲でも使用できます。また、球が大きいため、低 kV 範囲でも使用できます。低い倍率から始めて、小さい球体を（はるかに）高い倍率で拡大します。
- EM-Tec 7 は、10～100nm の Sn 球を含有。滑らかな Sn 球層により、高解像度 SEM および FESEM に最適な試験片です。30,000 倍以上の倍率でご使用ください。

EM-Tec の解像度標準試料は、マウントされていない状態、または一般的な SEM スタブにマウントされた状態で提供されます。下の校正標準試料および試験試料用の試料マウントの選択リストをご参照ください。

EM-TecAu on C 解像度標準

EM-Tec Au on C 解像度標準 1 Au 粒子のサイズ：5-200nm



カーボン基板の上に Au 粒子を付着させた Au on C 解像度試験用標準試料です。Au 粒子のサイズは 5~200nm です。

カーボン基板の直径は 6mm、高さは 2mm です。

Au は優れた SE 信号を提供し、暗い炭素の背景により個々の Au 粒子が分離されます。機能豊富な Au 粒子は、標準的 SEM での解像度テストに最適です。

15,000 倍以上の倍率でご使用ください。

歪み、非点収差、像のずれを補正し、適切な焦点、ビームサイズ、コントラスト、明るさを調整するのに最適です。

この解像度標準には、別売の位置の特定と位置決めを容易にする正方形のメッシュグリッドパターンがオプションで別途ご用意しています。

マウントなし、または一般的な SEM スタブにマウントされた状態をご利用いただけます。

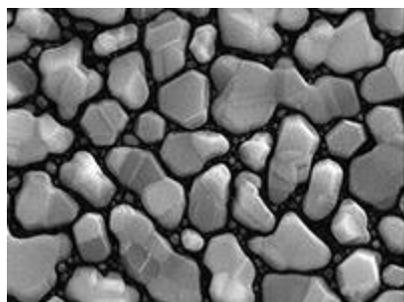
複数の SEM プラットフォームをご利用の場合は、SEM スタブアダプターのページをご覧ください。

SEM スタブアダプターを使用すると、すべての SEM で単一の解像度基準を使用できます。

パーツ番号	取付スタブ	数量	価格
31-021100-U	マウントなし	1 個	¥59,400
31-021100-1	Ø12.7mm ピンスタブ	1 個	¥59,400
31-021100-2	Ø12.7mm Zeiss スタブ	1 個	¥59,400
31-021100-6	Ø12.2mm JEOL スタブ	1 個	¥59,400
31-021100-8	Ø15mm 日立 M4 スタブ	1 個	¥59,400

EM-Tec Au on C 解像度標準 2

Au 粒子のサイズ 30-300nm



C 基板上に配置された、より大きな Au 粒子を含有する Au on C 解像度試験用標準試料。Au 粒子のサイズは 30~300nm です。

C 基質は直径 6mm、高さ 2mm です。大きな金粒子は優れた SE 信号を提供し、暗い炭素背景が個々の金粒子を分離します。

機能豊富な大型 Au 粒子は、低 kV および中倍率範囲に最適です。10,000 倍以上の倍率でご使用ください。

歪み、非点収差、画像シフトを補正し、正しい焦点、ビームサイズ、コントラスト、明るさを調整するのに最適です。この解像度標準には、別売の位置の特定と位置決めを容易にする正方形のメッシュ グリッド パターンをご用意しております。マウントなし、または一般的な SEM スタブにマウントされた状態でご利用いただけます。

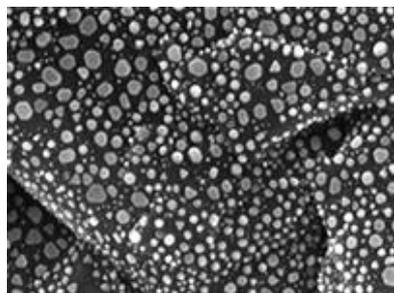
複数の SEM プラットフォームをご利用の場合は、SEM スタブアダプターのページをご覧ください。

SEM スタブアダプターを使用すると、すべての SEM で単一の解像度標準を使用できます。

パーツ番号	マウントスタブ	数量	価格
31-021200-U	マウントなし	1 個	¥64,500
31-021200-1	Ø12.7mm ピンスタブ	1 個	¥64,500
31-021200-2	Ø12.7mm Zeiss スタブ	1 個	¥64,500
31-021200-6	Ø12.2mm JEOL スタブ	1 個	¥64,500
31-021200-8	Ø15mm 日立 M4 スタブ	1 個	¥64,500

EM-Tec Au on C 解像度標準 3

Au 粒子のサイズ 3-50nm



カーボン基板上に微細な金粒子を塗布した Au on C 解像度標準試料です。金粒子のサイズは 3~50nm です。

C 基板は直径 6mm、高さ 2mm です。微細な Au は優れた SE 信号を提供し、暗い炭素背景が個々の Au 粒子を分離します。より微細な Au 粒子は、標準的な SEM および FESEM による高解像度検査に最適です。

50,000 倍以上の倍率でご使用ください。

非点収差や画像シフトに適しており、高解像度画像のために正しい焦点、ビーム サイズ、コントラスト、明るさを調整するのに最適です。この解像度標準には、別売の位置の特定と位置決めを容易にする正方形のメッシュ グリッド パターンをご用意しております。

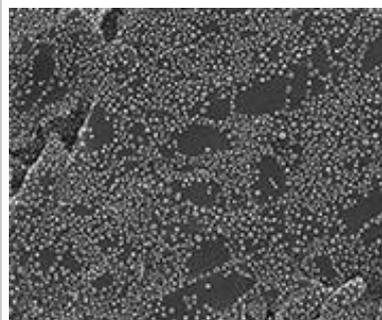
マウントなし、または一般的な SEM スタブにマウントされた状態をご利用いただけます。

複数の SEM プラットフォームをご利用の場合は、SEM スタブアダプターのページをご覧ください。

SEM スタブ アダプターを使用すると、すべての SEM で単一の解像度標準を使用できます。

パーツ番号	マウントスタブ	数量	価格
31-021300-U	マウントなし	1 個	¥138,600
31-021300-1	Ø12.7mm ピンスタブ	1 個	¥138,600
31-021300-2	Ø12.7mm Zeiss スタブ	1 個	¥138,600
31-021300-6	Ø12.2mm JEOL スタブ	1 個	¥138,600
31-021300-8	Ø15mm 日立 M4 スタブ	1 個	¥138,600

EM-Tec Au on C 解像度標準 4 Au 粒子のサイズ 2-30nm



C 基板の上に微細な Au 粒子を塗布した Au on C 解像度標準試料です。Au 粒子のサイズは 2~30nm です。C 基板の直径は 6mm、高さは 2mm です。より微細な Au 粒子は優れた SE 信号を提供し、暗い C 背景が個々の Au 粒子を分離します。より微細な Au 粒子は、FESEM における超高解像度検査に最適です。100,000 倍以上の倍率でご使用ください。非点収差や像のずれを補正し、焦点、ビームサイズ、コントラスト、明るさを調整して超高解像度画像を得るのに最適です。

別商品にこの解像度標準に適した、位置の特定と位置決めを容易にする正方形のメッシュ グリッド パターンをご用意しています。マウントなし、または一般的な SEM スタブにマウントされた状態をご利用いただけます。

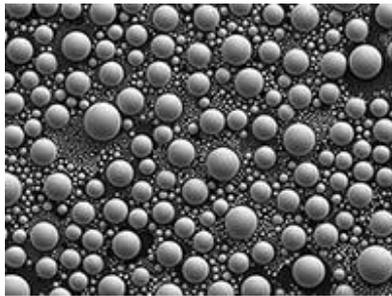
複数の SEM プラットフォームをご利用の場合は、SEM スタブアダプターのページをご覧ください。

SEM スタブアダプターを使用すると、すべての SEM で単一の解像度基準を使用できます。

パーツ番号	マウントスタブ	数量	価格
31-021400-U	スタブなし	1 個	¥138,600
31-021400-1	Ø12.7mm ピンスタブ	1 個	¥138,600
31-021400-2	Ø12.7mm Zeiss スタブ	1 個	¥138,600
31-021400-6	Ø12.2mm JEOL スタブ	1 個	¥138,600
31-021400-8	Ø15mm 日立 M4 スタブ	1 個	¥138,600

EM-Tec Sn on C 解像度標準

EM-Tec Sn on C 解像度標準 6 Sn 粒子のサイズ 5nm-30um



C 基板上に Sn 球を付着させた **Sn on C** の解像度標準です。

Sn のサイズ範囲は 5nm~30 μ m。

カーボン基板のサイズは直径 6mm、高さ 2mm です。

球体サイズの範囲が広いため、この解像度標準は広範囲の倍率と動作電圧に最適です。

100 倍という低倍率から使用でき、小さな球体を拡大して高倍率にすることができます。ほぼ完璧な円形の球面は、標準的な SEM での解像度テストに最適です。

15,000 倍以上の倍率でご使用ください。標準 SEM、卓上 SEM、トレーニング目的に使用できる、使いやすい解像度の標準です。

フィラメント交換後にパフォーマンスをテストし、SEM を最適化するための優れたツールです。

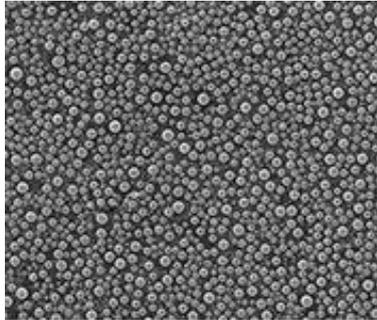
マウントされていない状態、または最も一般的な SEM スタブにマウントされた状態で使用可能です。

複数の SEM プラットフォームをご利用の場合は、SEM スタブアダプターのページをご覧ください。

SEM スタブアダプターを使用すると、すべての SEM で単一の解像度標準を使用できます。

パーツ番号	マウントスタブ	数量	価格
31-022100-U	マウントなし	1 個	¥103,000
31-022100-1	Ø12.7mm ピンスタブ	1 個	¥103,000
31-022100-2	Ø12.7mm Zeiss スタブ	1 個	¥103,000
31-022100-6	Ø12.2mm JEOL スタブ	1 個	¥103,000
31-022100-8	Ø15mm 日立 M4 スタブ	1 個	¥103,000

EM-Tec Sn on C 解像度標準 7 Sn 粒子のサイズ 10-100nm



C 基板の上に Sn 球を載せた Sn on C 解像度標準です。
Sn 球のサイズ範囲は 10~100nm、炭素元板のサイズは直径 6mm、高さ 2mm です。
ほぼ完璧な円形の球体により、歪み、非点収差、像のずれを簡単に補正し、適切なコントラストと明るさの調整ができます。
この解像度標準は比較的滑らかな層を備えており、標準 SEM および FESEM で 30,000 倍以上の高倍率で使用することを目的としています。
この解像度標準には、別売で位置の特定と位置決めを容易にする正方形のメッシュ グリッド パターンが用意されています。
マウントなし、または一般的な SEM スタブにマウントされた状態でご利用いただけます。
複数の SEM プラットフォームをご利用の場合は、SEM スタブアダプターのページをご覧ください。
SEM スタブ アダプタを使用すると、すべての SEM で単一の解像度標準が使用できます。

パーツ番号	マウントスタブ	数量	価格
31-022300-U	マウントなし	1 個	¥74,000
31-022300-1	Ø12.7mm ピンスタブ	1 個	¥74,000
31-022300-2	Ø12.7mm Zeiss スタブ	1 個	¥74,000
31-022300-6	Ø12.2mm JEOL スタブ	1 個	¥74,000
31-022300-8	Ø15mm 日立 M4 スタブ	1 個	¥74,000

備考：本内容は予告なしに変更されることがございます。